PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2000-328004

(43)Date of publication of application: 28.11.2000

(51)Int.CI.

C09D183/06 C08G 77/04 CO9D 5/25 H01L 21/312

(21)Application number: 11-140923

(71)Applicant:

(22)Date of filing: 21.05.1999 (72)Inventor:

JSR CORP

NISHIKAWA MICHINORI TSUNODA MAYUMI

SHINODA TOMOTAKA YAMADA KINJI

(54) COMPOSITION FOR FORMING FILM AND MATERIAL FOR FORMING INSULATING FILM (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To improve mechanical strengths of a coating film to enable its formation having uniform thickness, hardly to generate cracks and to have a low dielectric constant by including a hydrolytic condensation product of two silane compounds.

SOLUTION: A composition for forming a film is obtained by including a hydrolytic condensation product of (A) 100 pts.wt. (conversion into the fully hydrolytic condensation product) of a silane compound of the formula: (R1)aSi(OR2)4-a and 4-200 pts.wt. (conversion into the fully hydrolytic condensation product) of a silane compound of the formula: (R3)bSi(OR4)4-b. In the formulas, R1 is a monovalent group selected from methyl, ethyl, vinyl and phenyl; a is 0-2; R3 is a 4 or more C straight chain alkyl, branched chain alkyl or alicyclic alkyl; R4 is a monovalent organic group; and b is 1-2. The hydrolytic condensation product is obtained by hydrolyzing and/or condensing the components A and B under the presence of a catalyst and water in an organic solvent.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

THIS PAGE BLANK (USPTO)

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2000-328004 (P2000-328004A)

(43)公開日 平成12年11月28日(2000.11.28)

(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	テーマコード(参考)
C 0 9 D 183/06		C 0 9 D 183/06	41035
C08G 77/04		C08G 77/04	4 J 0 3 8
C 0 9 D 5/25		C 0 9 D 5/25	5F058
H01L 21/312		H 0 1 L 21/312	С

審査請求 未請求 請求項の数3 OL (全 12 頁)

(21)出願番号	特顧平11-140923	(71)出顧人	000004178
			ジェイエスアール株式会社
(22)出顧日	平成11年5月21日(1999.5.21)		東京都中央区築地2丁目11番24号
		(72)発明者	西川 通則
			東京都中央区築地二丁目11番24号 ジェイ
			エスアール株式会社内
		(72)発明者	角田 真由美
			東京都中央区築地二丁目11番24号 ジェイ
		1	エスアール株式会社内
		(74)代理人	100085224
		7,422,7	弁理士 白井 重隆

最終質に続く

(54) 【発明の名称】 膜形成用組成物および絶縁膜形成用材料

(57)【要約】

【課題】 半導体素子などにおける層間絶縁膜として適当な、均一な厚さを有する塗膜が形成可能な、しかもクラックが生じ難く、非常に低い誘電率を与え、塗膜の機械的強度などのバランスに優れる膜形成用組成物を提供すること。

【特許請求の範囲】

【請求項 1 】 (A) 下記一般式(1) で表される化合

 $(R^1)_a Si (OR^2)_{4-a}$ \cdots (1)

(R¹ はメチル基、エチル基、ビニル基、フェニル基か ら選ばれる1価の有機基を示し、R'は1価の有機基を 示し、aは0~2の整数である。)

(B) 下記一般式(2) で表される化合物

 $(R^{3})_{b} Si (OR^{4})_{4-b} \cdots (2)$

(R³ は炭素数4以上の直鎖アルキル基、分岐アルキル 10 基、脂肪族環状アルキル基を示し、R* は1価の有機基 を示し、bは1~2の整数である。) との加水分解縮合 物を含有することを特徴とする膜形成用組成物。

(A)成分(完全加水分解縮合物換算) 【請求項2】 100重量部に対して、(B)成分(完全加水分解縮合 物換算)が40~200重量部である請求項1記載の膜 形成用組成物。

【請求項3】 請求項1または2記載の膜形成用組成物 からなることを特徴とする絶縁膜形成用材料。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、膜形成用組成物に 関し、さらに詳しくは、半導体素子などにおける層間絶 縁膜として適当な、均一な厚さを有する塗膜が形成可能 な、しかもクラックが生じ難く、非常に低い誘電率を与 え、塗膜の機械的強度に優れる膜形成用組成物に関す る。

[0002]

【従来の技術】従来、半導体素子などにおける層間絶縁 膜として、CVD法などの真空プロセスで形成されたシ 30 リカ(SiO。)膜が多用されている。そして、近年、 より均一な層間絶縁膜を形成することを目的として、S OG (Spin on Glass) 膜と呼ばれるテト ラアルコキシランの加水分解生成物を主成分とする塗布 型の絶縁膜も使用されるようになっている。また、半導 体素子などの髙集積化に伴い、有機SOGと呼ばれるオ ルガノポリシロキサンを主成分とする低誘電率の層間絶 縁膜が開発されている。しかしながら、半導体素子など のさらなる高集積化や多層化に伴い、より優れた導体間 の電気絶縁性が要求されており、したがって、より低誘 電率でかつクラック耐性に優れる層間絶縁膜材料が求め られるようになっている。

【0003】そこで、特開平6-181201号公報に は、層間絶縁膜材料として、より低誘電率の絶縁膜形成 用塗布型組成物が開示されている。との塗布型組成物 は、吸水性が低く、耐クラック性に優れた半導体装置の 絶縁膜を提供することを目的としており、その構成は、 チタン、ジルコニウム、ニオブおよびタンタルから選ば れる少なくとも1種の元素を含む有機金属化合物と、分 子内にアルコキシ基を少なくとも1個有する有機ケイ素 50 の割合は、(A)成分(完全加水分解縮合物換算)10

化合物とを縮重合させてなる、数平均分子量が500以 上のオリゴマーを主成分とする絶縁膜形成用塗布型組成 物である。

【0004】また、WO96/00758号公報には、 多層配線基板の層間絶縁膜の形成に使用される、アルコ キシシラン類、シラン以外の金属アルコキシドおよび有 機溶媒などからなる、厚膜塗布が可能で、かつ耐酸素プ ラズマアッシング性に優れるシリカ系塗布型絶縁膜形成 用材料が開示されている。

【0005】また、特開平3-20377号公報には、 電子部品などの表面平坦化、層間絶縁などに有用な酸化 物被膜形成用塗布液が開示されている。この酸化物被膜 形成用塗布液は、ゲル状物の発生のない均一な塗布液を 提供し、また、この塗布液を用いることにより、高温で の硬化、酸素プラズマによる処理を行った場合であって も、クラックのない良好な酸化物被膜を得ることを目的 としている。そして、その構成は、所定のシラン化合物 と、同じく所定のキレート化合物とを有機溶媒の存在化 で加水分解し、重合して得られる酸化物被膜形成用塗布 20 液である。

【0006】しかし、上記のように、シラン化合物にチ タンやジルコニウムなどの金属キレート化合物を組み合 せた場合、塗膜の均一性が優れず、さらに誘電率、クラ ック耐性などをバランスよく有するものではない。 [0007]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、上記問題点 を解決するための膜形成用組成物に関し、さらに詳しく は、半導体素子などにおける層間絶縁膜として適当な、 均一な厚さを有する塗膜が形成可能な、しかもクラック が生じ難く、非常に低い誘電率を与え、塗膜の機械的強 度などのバランスに優れる膜形成用組成物を提供するこ とを目的としている。

[0008]

【課題を解決するための手段】本発明は、(A)下記一 般式 (1) で表される化合物 (以下「 (A) 成分」とも いう)、および

 $(R^1)_a$ Si $(OR^2)_{4-a}$ ·····(1)

(R1 はメチル基、エチル基、ビニル基、フェニル基か ら選ばれる1価の有機基を示し、R'は1価の有機基を 40 示し、aは0~2の整数である。)

(B) 下記一般式(2) で表される化合物(以下

「(B)成分」ともいう)

 \cdots (2) $(R^3)_b$ Si $(OR^4)_{4-b}$

(R³ は炭素数4以上の直鎖アルキル基、分岐アルキル 基、脂肪族環状アルキル基を示し、R * は1価の有機基 を示し、bは1~2の整数である。) を有機溶剤中で触 媒および水の存在下で加水分解および/または縮合した 加水分解縮合物を含有することを特徴とする膜形成用組 成物に関するものである。ここで、(A)~(B)成分

0重量部に対して、(B)成分(完全加水分解縮合物換 算)が40~200重量部であることが好ましい。ま た、本発明は、上記膜形成用組成物からなることを特徴 とする絶縁膜形成用材料に関する。

[0009]

【発明の実施の形態】本発明は、膜を形成するベースポ リマーとして、(A)成分と(B)成分との加水分解物 および/または縮合物である加水分解縮合物が二次元~ 三次元的な構造をとる組成物である。本発明の組成物 エハなどの基材に塗布すると、例えば、微細パターン間 の溝を充分に埋めることができ、加熱により、有機溶剤 の除去と熱縮重合を行なうと、(A)成分と(B)成分 との加水分解縮合物が高分子量を有するポリオルガノシ ロキサンを生成し、ガラス質または巨大高分子の膜を形 成することができる。得られる膜は、密着性が良好で、 平坦化に優れ、クラックの発生がなく、非常に低い誘電 率を与え、塗膜の機械的強度に優れる、厚膜の絶縁体を 形成することができる。

【0010】ととで、上記加水分解物とは、上記(A) 成分に含まれるR'O-基や(B)成分に含まれるR' 〇-基すべてが加水分解されている必要はなく、例え ば、1個だけが加水分解されているもの、2個以上が加 水分解されているもの、あるいは、これらの混合物であ ってもよい。また、上記縮合物は、(A)成分や(B) 成分の加水分解物のシラノール基が縮合してSi-O-Si結合を形成したものであるが、本発明では、シラノ ール基がすべて縮合している必要はなく、僅かな一部の シラノール基が縮合したもの、縮合の程度が異なってい るものの混合物などをも包含した概念である。

【0011】以下、本発明に用いられる(A)成分、

(B) 成分などについて説明し、次いで、本発明の組成 物の調製方法について詳述する。

【0012】(A)成分

上記一般式(1)のR'は1価の有機基であり、アルキ ル基、アリール基、アリル基、グリシジル基などを挙げ ることができる。ここで、アルキル基としては、メチル 基、エチル基、ビニル基、プロビル基、ブチル基などが 挙げられ、好ましくは炭素数1~5であり、これらのア 原子がフッ素原子などに置換されていてもよい。一般式 (1) において、アリール基としては、フェニル基、ナ フチル基などを挙げることができる。

【0013】一般式(1)で表される化合物の具体例と しては、例えば、テトラメトキシシラン、テトラエトキ シシラン、テトラーnープロポキシシラン、テトラーi soープロポキシシラン、テトラーnーブトキシラン、 テトラーsecーブトキシシラン、テトラーtert-ブトキシシラン、テトラフェノキシシラン;

トキシシラン、メチルトリーnープロポキシシラン、メ チルトリーiso-プロポキシシラン、メチルトリーn ーブトキシシラン、メチルトリーsec-ブトキシシラ ン、メチルトリーtert-ブトキシシラン、メチルト リフェノキシシラン、エチルトリメトキシシラン、エチ ルトリエトキシシラン、エチルトリーn-プロポキシシ ラン、エチルトリーiso-プロポキシシラン、エチル トリーnーブトキシシラン、エチルトリーsec-ブト キシシラン、エチルトリーtert-ブトキシシラン。 を、浸漬またはスピンコート法などにより、シリコンウ 10 エチルトリフェノキシシラン、ビニルトリメトキシシラ ン、ビニルトリエトキシシラン、ビニルトリーn-プロ ポキシシラン、ビニルトリーiso-プロポキシシラ ン、ビニルトリーnーブトキシシラン、ビニルトリーs ecーブトキシシラン、ビニルトリーtertーブトキ シシラン、ビニルトリフェノキシシラン、フェニルトリ メトキシシラン、フェニルトリエトキシシラン、フェニ ルトリーnープロポキシシラン、フェニルトリーiso -プロポキシシラン、フェニルトリ-n-ブトキシシラ ン、フェニルトリーsec-ブトキシシラン、フェニル 20 トリーtert‐ブトキシシラン、フェニルトリフェノ キシシラン:

【0015】ジメチルジメトキシシラン、ジメチルジェ トキシシラン、ジメチルージーn-プロポキシシラン ジメチルージーiso-プロポキシシラン、ジメチルー ジーn-ブトキシシラン、ジメチル-ジ-sec-ブト キシシラン、ジメチルージーtert~ブトキシシラ ン、ジメチルジフェノキシシラン、ジエチルジメトキシ シラン、ジエチルジエトキシシラン、ジエチルージーn ープロポキシシラン、ジエチルージー i s o ープロポキ 30 シシラン、ジエチルージーnーブトキシシラン、ジェチ ルージーsecーブトキシシラン、ジエチルージーte rtーブトキシシラン、ジエチルジフェノキシシラン。 ジフェニルジメトキシシラン、ジフェニルージーエトキ シシラン、ジフェニルージーn - プロポキシシラン、ジ フェニルージーiso-プロポキシシラン、ジフェニル ージ-n -ブトキシシラン、ジフェニル-ジ-sec-ブトキシシラン、ジフェニルージーtertーブトキシ シラン、ジフェニルジフェノキシシラン、ジビニルジメ トキシシラン、ジビニルジエトキシシラン;ャーアミノ ルキル基は鎖状でも、分岐していてもよく、さらに水素 40 プロビルトリメトキシシラン、ァーアミノプロビルトリ エトキシシラン、ケーグリシドキシプロピルトリメトキ シシラン、ァーグリシドキシプロピルトリエトキシシラ ン、ケートリフロロプロピルトリメトキシシラン、ケー トリフロロプロピルトリエトキシシラン: などを挙げる ことができる。

【0016】これらのうち、テトラメトキシシラン、テ トラエトキシシラン、テトラーnープロポキシシラン、 テトラーisoープロポキシシラン、メチルトリメトキ シシラン、メチルトリエトキシシラン、ビニルトリメト 【0014】メチルトリメトキシシラン、メチルトリエ 50 キシシラン、ビニルトリエトキシシラン、フェニルトリ

メトキシシラン、フェニルトリエトキシシラン、ジメチ ルジメトキシシラン、ジメチルジエトキシシラン、ジフ ェニルジメトキシシラン、ジフェニルジエトキシシラン を、より好ましい例として挙げることができる。これら の(A)成分は、1種あるいは2種以上を同時に使用し てもよい。

【0017】(B)成分

上記一般式(2)において、R³は、炭素数4以上、好 ましくは4~20の直鎖アルキル基、分岐アルキル基、 または脂肪族環状アルキル基である。とこで、直鎖アル 10 キル基としては、n-ブチル基、n-ペンチル基、n-ヘキシル基、n-ヘプチル基、n-オクチル基、n-ノ ニル基、n-デシル基、n-ドデシル基、n-トリデシ ル基、n-テトラデシル基、n-ペンタデシル基、n-ヘキサデシル基、n – ヘプタデシル基、n – オクタデシ ル基、n-オクタデシル基、n-エイコシル基などを挙 げることができ、分岐アルキル基としては、isoーブ チル基、tert‐ブチル基などを挙げることができ、 脂肪族環状アルキル基としては、シクロベンチル基、シ クロヘキシル基、ジシクロヘキシル基、トリシクロヘキ 20 シル基などが挙げられる。また、一般式(2)におい て、R⁴ は1価の有機基を示し、先の(A)成分中のR 'と同様な基を挙げることができる。

【0018】一般式(2)で表される化合物の具体例と しては、n-ブチルトリメトキシシラン、n-ブチルト リエトキシシラン、n-ブチルトリーiso-プロピキ シシラン、n-ブチルトリ-n-ブトキシシラン、n-ブチルトリーiso-ブトキシシシラン、n-ブチルト リーtert-ブトキシシラン、iso-ブチルトリメ トキシシラン、iso-ブチルトリエトキシシラン、i so-ブチルトリーiso-プロピキシシラン、iso **-ブチルトリ-n-ブトキシシラン、iso-ブチルト** リーisoープトキシシシラン、isoープチルトリー tert-ブトキシシラン、tert-ブチルトリメト キシシラン、tert‐ブチルトリエトキシシラン、t ertーブチルトリーisoープロピキシシラン、te rtーブチルトリーnーブトキシシラン、tertーブ チルトリーiso-ブトキシシシラン、tert-ブチ ルトリーtert-ブトキシシラン、n-ペンチルトリ メトキシシラン、n-ペンチルトリエトキシシラン、n ーペンチルトリーisoープロピキシシラン、nーペン チルトリーn-ブトキシシラン、n-ペンチルトリーi so-ブトキシシシラン、n-ペンチルトリーtert -ブトキシシラン、n-ヘキシルトリメトキシシラン、 n-ヘキシルトリエトキシシラン、n-ヘキシルトリー isoープロピキシシラン、nーヘキシルトリーnーブ トキシシラン、n-ヘキシルトリ-iso-ブトキシシ シラン、n-ヘキシルトリーtert-ブトキシシラ ン、n -ヘプチルトリメトキシシラン、n -ヘプチルト リエトキシシラン、 \mathbf{n} - \mathbf{n} \mathbf{n}

キシシラン、n - ヘプチルトリ - n - ブトキシシラン、 n -ヘプチルトリー i s o -ブトキシシシラン、n -ヘ プチルトリーtert-ブトキシシラン、n-オクチル トリメトキシシラン、n-オクチルトリエトキシシラ ン、n-オクチルトリ-iso-プロビキシシラン、n -オクチルトリ-n - ブトキシシラン、n -オクチルト リーisoーブトキシシシラン、nーオクチルトリーt ertーブトキシシラン、n-ノニルトリメトキシシラ ン、n-ノニルトリエトキシシラン、n-ノニルトリisoープロビキシシラン、nーノニルトリーnーブト キシシラン、n-ノニルトリ-iso-ブトキシシシラ ン、n-ノニルトリーtert-ブトキシシラン、n-デシルトリメトキシシラン、n - デシルトリエトキシシ ラン、n – デシルトリーiso-プロピキシシラン、n **−デシルトリ−n−ブトキシシラン、n−デシルトリ−** iso-ブトキシシシラン、n-デシルトリーtert **−ブトキシシラン、n−ドデシルトリメトキシシラン、** n - ドデシルトリエトキシシラン、n - ドデシルトリー isoープロピキシシラン、nードデシルトリーnーブ トキシシラン、n-ドデシルトリ-iso-ブトキシシ シラン、n-ドデシルトリ-tert-ブトキシシラ ン、n-テトラデシルトリメトキシシラン、n-テトラ デシルトリエトキシシラン、n -テトラデシルトリー i so-プロピキシシラン、n-テトラデシルトリ-n-ブトキシシラン、n - テトラデシルトリー i s o - ブト キシシシラン、 n - テトラデシルトリーtert‐ブト キシシラン、n -ヘキサデシルトリメトキシシラン、n -ヘキサデシルトリエトキシシラン、n - ヘキサデシル トリーiso-プロピキシシラン、n-ヘキサデシルト リーn-ブトキシシラン、n-ヘキサデシルトリーis o-ブトキシシシラン、n-ヘキサデシルトリーter t-ブトキシシラン、n-オクタデシルトリメトキシシ ラン、n -オクタデシルトリエトキシシラン、n -オク タデシルトリーiso-プロビキシシラン、n-オクタ デシルトリーn -ブトキシシラン、n -オクタデシルト リーiso-ブトキシシシラン、n-オクタデシルトリ - t e r t - ブトキシシラン、シクロペンチルトリメト キシシラン、シクロペンチルトリエトキシシラン、シク ロベンチルトリーiso-プロピキシシラン、シクロベ ンチルトリーn-ブトキシシラン、シクロペンチルトリ - i s o - ブトキシシシラン、シクロペンチルトリー t ertーブトキシシラン、シクロヘキシルトリメトキシ シラン、シクロヘキシルトリエトキシシラン、シクロヘ **キシルトリーiso-プロビキシシラン、シクロヘキシ** ルトリーn-ブトキシシラン、シクロヘキシルトリ-i so-ブトキシシシラン、シクロヘキシルトリーter t - ブトキシシラン、ジシクロヘキシルトリメトキシシ ラン、ジシクロヘキシルトリエトキシシラン、ジシクロ ヘキシルトリーiso-プロピキシシラン、ジシクロヘ

8

リーisoープトキシシシラン、ジシクロヘキシルトリ -tert-ブトキシシラン、トリシクロヘキシルトリ メトキシシラン、トリシクロヘキシルトリエトキシシラ ン、トリシクロヘキシルトリーiso-プロピキシシラ ン、トリシクロヘキシルトリーn-ブトキシシラン、ト リシクロヘキシルトリーiso-ブトキシシシラン、ト リシクロヘキシルトリーtert‐ブトキシシラン; 【0019】ジーnーブチルジメトキシシラン、ジーn -ブチルジエトキシシラン、ジ-iso-ブチルジメト -tert-ブチルジメトキシシラン、ジーtert-ブチルジエトキシシラン、ジ-n-ペンチルジメトキシ シラン、ジーnーペンチルジエトキシシラン、ジーnー ヘキシルジメトキシシラン、ジーn-ヘキシルジエトキ シシラン、ジシクロベンチルジメトキシシラン、ジシク ロペンチルジェトキシシラン、ジシルクヘキシルジメト キシシラン、ジシルクヘキシルジェトキシシラン、ビス (ジシクロヘキシル) ジメトキシシラン、ビス (ジシク ロヘキシル) ジェトキシシラン、ビス (トリシクロヘキ シル) ジメトキシシラン、ビス(トリシクロヘキシル) 20 -n-ブトキシ・ビス(アセチルアセトナート)チタ ジエトキシシラン;などを挙げることができる。

【0020】(B)成分として、n-ブチルトリメトキ シシラン、n-ブチルトリエトキシシラン、iso-ブ チルトリメトキシシラン、iso-ブチルトリエトキシ シラン、tert‐ブチルトリメトキシシラン、ter t-ブチルトリエトキシシラン、n-ペンチルトリメト キシシラン、n-ペンチルトリエトキシシラン、n-ヘ キシルトリメトキシシラン、n-ヘキシルトリエトキシ シラン、n-オクチルトリメトキシシラン、n-オクチ ルトリエトキシシラン、n-デシルトリメトキシシラ ン、n-デシルトリエトキシシラン、n-ドデシルトリ メトキシシラン、n-ドデシルトリエトキシシラン、n -テトラデシルトリメトキシシラン、n-テトラデシル トリエトキシシラン、n-ヘキサデシルトリメトキシシ ラン、n - ヘキサデシルトリエトキシシラン、n - オク タデシルトリメトキシシラン、n-オクタデシルトリエ トキシシラン、シクロペンチルトリメトキシシラン、シ クロペンチルトリエトキシシラン、シクロヘキシルトリ メトキシシラン、シクロヘキシルトリエトキシシラン、 ルトリエトキシシラン、トリシクロヘキシルトリメトキ シシラン、トリシクロヘキシルトリエトキシシラン、ジ -n-ブチルジメトキシシラン、ジ-n-ブチルジエト キシシラン、ジーiso-ブチルジメトキシシラン、ジ -iso-ブチルジエトキシシラン、ジーtert-ブ チルジメトキシシラン、ジーtert‐ブチルジエトキ シシラン、ジーn-ペンチルジメトキシシラン、ジーn -ペンチルジエトキシシラン、ジ-n-ヘキシルジメト キシシラン、ジーnーヘキシルジエトキシシラン、ジシ クロベンチルジメトキシシラン、ジシクロベンチルジエ 50 -ブトキシ・トリス (エチルアセトアセテート) チタ

トキシシラン、ジシルクヘキシルジメトキシシラン、ジ シルクヘキシルジエトキシシランが、より好ましい例と して挙げることができる。以上の(B)成分は、1種あ るいは2種以上を同時に使用してもよい。

【0021】触媒

(A) 成分および(B) 成分を加水分解および/または 縮合させる際に使用する触媒としては、金属キレート化 合物、有機酸、無機酸、有機塩基、無機塩基を挙げると とができる。金属キレート化合物としては、例えば、ト キシシラン、ジーiso~ブチルジエトキシシラン、ジ 10 リエトキシ・モノ (アセチルアセトナート) チタン、ト リーn-プロポキシ・モノ (アセチルアセトナート) チ タン、トリーi-プロポキシ・モノ(アセチルアセトナ ート) チタン、トリーn-ブトキシ・モノ (アセチルア セトナート) チタン、トリーSec‐ブトキシ・モノ (アセチルアセトナート) チタン、トリーt-ブトキシ ・モノ (アセチルアセトナート) チタン、ジエトキシ・ ビス (アセチルアセトナート) チタン、ジーn-プロポ キシ・ビス (アセチルアセトナート) チタン、ジーi-プロポキシ・ビス (アセチルアセトナート) チタン、ジ ン、ジーsec‐ブトキシ・ビス(アセチルアセトナー ト) チタン、ジー t - ブトキシ・ビス (アセチルアセト ナート) チタン、モノエトキシ・トリス (アセチルアセ トナート) チタン、モノーn-プロポキシ・トリス (ア セチルアセトナート) チタン、モノー i - プロポキシ・ トリス (アセチルアセトナート) チタン、モノーローブ トキシ・トリス (アセチルアセトナート) チタン、モノ -sec-ブトキシ・トリス (アセチルアセトナート) チタン、モノー t ープトキシ・トリス (アセチルアセト 30 ナート) チタン、テトラキス (アセチルアセトナート) チタン、トリエトキシ・モノ (エチルアセトアセテー ト) チタン、トリーn-プロポキシ・モノ (エチルアセ トアセテート) チタン、トリーi-プロポキシ・モノ (エチルアセトアセテート) チタン、トリーn-ブトキ シ・モノ (エチルアセトアセテート) チタン、トリーs ec-ブトキシ・モノ (エチルアセトアセテート) チタ ン、トリー t ープトキシ・モノ (エチルアセトアセテー ト) チタン、ジエトキシ・ビス (エチルアセトアセテー ト) チタン、ジ-n-プロポキシ・ビス (エチルアセト ジシクロヘキシルトリメトキシシラン、ジシクロヘキシ 40 アセテート) チタン、ジーi-プロポキシ・ビス (エチ ルアセトアセテート) チタン、ジーn-ブトキシ・ビス (エチルアセトアセテート) チタン、ジーsecーブト キシ・ビス (エチルアセトアセテート) チタン、ジー t -ブトキシ・ビス (エチルアセトアセテート) チタン、 モノエトキシ・トリス (エチルアセトアセテート) チタ ン、モノーn-プロポキシ・トリス (エチルアセトアセ テート) チタン、モノーi-プロポキシ・トリス (エチ ルアセトアセテート) チタン、モノーn-ブトキシ・ト リス (エチルアセトアセテート) チタン、モノーSec

ン、モノー t - ブトキシ・トリス (エチルアセトアセテ ート) チタン、テトラキス (エチルアセトアセテート) チタン、モノ (アセチルアセトナート) トリス (エチル アセトアセテート) チタン、ビス (アセチルアセトナー ト) ビス (エチルアセトアセテート) チタン、トリス (アセチルアセトナート) モノ (エチルアセトアセテー

ト) チタンなどのチタンキレート化合物; 【0022】トリエトキシ・モノ(アセチルアセトナー ト) ジルコニウム、トリ-n-プロポキシ・モノ (アセ チルアセトナート)ジルコニウム、トリー i - プロポキ 10 ト)ジルコニウムなどのジルコニウムキレート化合物; シ・モノ (アセチルアセトナート) ジルコニウム、トリ - n - ブトキシ・モノ (アセチルアセトナート) ジルコ ニウム、トリーsec-ブトキシ・モノ(アセチルアセ トナート) ジルコニウム、トリー t -ブトキシ・モノ (アセチルアセトナート) ジルコニウム、ジエトキシ・ ビス (アセチルアセトナート) ジルコニウム、ジーn-プロポキシ・ビス(アセチルアセトナート)ジルコニウ ム、ジー i -プロポキシ・ビス(アセチルアセトナー ト) ジルコニウム、ジ-n-ブトキシ・ビス (アセチル アセトナート) ジルコニウム、ジ-sec-ブトキシ・ ビス (アセチルアセトナート) ジルコニウム、ジー t -ブトキシ・ビス (アセチルアセトナート) ジルコニウ ム、モノエトキシ・トリス (アセチルアセトナート) ジ ルコニウム、モノー n - プロポキシ・トリス (アセチル アセトナート) ジルコニウム、モノー i - プロポキシ・ トリス (アセチルアセトナート) ジルコニウム、モノー n-ブトキシ・トリス (アセチルアセトナート) ジルコ ニウム、モノーsec-ブトキシ・トリス(アセチルア セトナート) ジルコニウム、モノー t - ブトキシ・トリ ス (アセチルアセトナート) ジルコニウム、テトラキス 30 (アセチルアセトナート) ジルコニウム、トリエトキシ ・モノ (エチルアセトアセテート) ジルコニウム、トリ -n-プロポキシ・モノ (エチルアセトアセテート) ジ ルコニウム、トリー i ープロポキシ・モノ (エチルアセ トアセテート) ジルコニウム、トリーn – ブトキシ・モ ノ (エチルアセトアセテート) ジルコニウム、トリー s e c - ブトキシ・モノ (エチルアセトアセテート) ジル コニウム、トリー t ープトキシ・モノ (エチルアセトア セテート) ジルコニウム、ジエトキシ・ビス (エチルア セトアセテート) ジルコニウム、ジ-n-プロポキシ・ ビス (エチルアセトアセテート) ジルコニウム、ジー i **– プロポキシ・ビス(エチルアセトアセテート)ジルコ** ニウム、ジーn – ブトキシ・ビス (エチルアセトアセテ ート) ジルコニウム、ジ-sec-ブトキシ・ビス (エ チルアセトアセテート) ジルコニウム、ジー t - ブトキ シ・ビス (エチルアセトアセテート) ジルコニウム、モ ノエトキシ・トリス (エチルアセトアセテート) ジルコ ニウム、モノーn – プロポキシ・トリス (エチルアセト アセテート) ジルコニウム、モノー i - プロポキシ・ト リス (エチルアセトアセテート) ジルコニウム、モノー 50 0.25~3モルの水を用いることが好ましく、0.3

10

n – ブトキシ・トリス (エチルアセトアセテート) ジル コニウム、モノーsec-ブトキシ・トリス(エチルア セトアセテート) ジルコニウム、モノー t -プトキシ・ トリス (エチルアセトアセテート) ジルコニウム、テト ラキス(エチルアセトアセテート)ジルコニウム、モノ (アセチルアセトナート) トリス (エチルアセトアセテ ート) ジルコニウム、ビス(アセチルアセトナート)ビ ス (エチルアセトアセテート) ジルコニウム、トリス (アセチルアセトナート) モノ (エチルアセトアセテー 【0023】トリス (アセチルアセトナート) アルミニ ウム、トリス (エチルアセトアセテート) アルミニウム などのアルミニウムキレート化合物;などを挙げること ができる。

【0024】有機酸としては、例えば、酢酸、プロピオ ン酸、ブタン酸、ペンタン酸、ヘキサン酸、ヘプタン 酸、オクタン酸、ノナン酸、デカン酸、シュウ酸、マレ イン酸、メチルマロン酸、アジピン酸、セバシン酸、没 食子酸、酪酸、メリット酸、アラキドン酸、シキミ酸、 20 2-エチルヘキサン酸、オレイン酸、ステアリン酸、リ ノール酸、リノレイン酸、サリチル酸、安息香酸、p -アミノ安息香酸、p-トルエンスルホン酸、ベンゼンス ルホン酸、モノクロロ酢酸、ジクロロ酢酸、トリクロロ 酢酸、トリフルオロ酢酸、ギ酸、マロン酸、スルホン 酸、フタル酸、フマル酸、クエン酸、酒石酸などを挙げ ることができる。無機酸としては、例えば、塩酸、硝 酸、硫酸、フッ酸、リン酸などを挙げることができる。 【0025】有機塩基としては、例えば、ビリジン、ビ ロール、ピペラジン、ピロリジン、ピペリジン、ピコリ ン、トリメチルアミン、トリエチルアミン、モノエタノ ールアミン、ジエタノールアミン、ジメチルモノエタノ ールアミン、モノメチルジエタノールアミン、トリエタ ノールアミン、ジアザビシクロオクラン、ジアザビシク ロノナン、ジアザビシクロウンデセン、テトラメチルア ンモニウムハイドロオキサイドなどを挙げることができ る。無機塩基としては、例えば、アンモニア、水酸化ナ トリウム、水酸化カリウム、水酸化バリウム、水酸化カ ルシウムなどを挙げることができる。これら触媒のう ち、金属キレート化合物、有機酸、無機酸が好ましく、 より好ましくはチタンキレート化合物、有機酸を挙げる ことができる。これらの触媒は、1種あるいは2種以上 を同時に使用してもよい。

【0026】上記触媒の使用量は、(A)成分および (B) 成分の合計量100重量部に対して、通常、0. 001~20重量部、好ましくは0.01~15重量部 の範囲である。

【0027】上記(A)成分および(B)成分を加水分 解、縮合させる際に、(A)成分中の-OR'基および (B) 成分中の-OR*で表される基1モル当たり、

(7)

~2.5モルの水を加えることが特に好ましい。添加す る水の量が0.25~3モルの範囲内の値であれば、塗 膜の均一性が低下する恐れが無く、また、膜形成用組成 物の保存安定性が低下する恐れが少ないためである。 【0028】有機溶剤

本発明に使用する有機溶剤としては、例えば、n-ペン タン、i-ペンタン、n-ヘキサン、i-ヘキサン、n ーヘプタン、i ーヘプタン、2、2、4 ートリメチルベ ンタン、nーオクタン、iーオクタン、シクロヘキサ ン、メチルシクロヘキサンなどの脂肪族炭化水素系溶 媒;ベンゼン、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、 トリメチルベンゼン、メチルエチルベンゼン、n-プロ ピルベンセン、i-プロピルベンセン、ジェチルベンゼ ン、 i ープチルベンゼン、トリエチルベンゼン、ジー i -プロピルベンセン、n-アミルナフタレン、トリメチ ルベンゼンなどの芳香族炭化水素系溶媒;

【0029】メタノール、エタノール、n-プロパノー ル、i-プロパノール、n-ブタノール、i-ブタノー ル、sec-ブタノール、t-ブタノール、n-ペンタ ec-ペンタノール、t-ペンタノール、3-メトキシ ブタノール、n-ヘキサノール、2-メチルペンタノー ル、sec‐ヘキサノール、2‐エチルブタノール、s ec-ヘプタノール、ヘプタノール-3、n-オクタノ ール、2-エチルヘキサノール、sec-オクタノー ル、n-ノニルアルコール、2,6-ジメチルヘプタノ $-\mu-4$ 、n-デカノール、sec-ウンデシルアルコール、トリメチルノニルアルコール、sec-テトラデ シルアルコール、Sec-ヘプタデシルアルコール、フ ェノール、シクロヘキサノール、メチルシクロヘキサノ 30 ール、3,3,5ートリメチルシクロヘキサノール、ベ ンジルアルコール、フェニルメチルカルビノール、ジア セトンアルコール、クレゾールなどのモノアルコール系 溶媒;

【0030】エチレングリコール、1、2-プロピレン グリコール、1,3-ブチレングリコール、ペンタンジ オールー2, 4、2-メチルペンタンジオール-2, 4、ヘキサンジオールー2、5、ヘプタンジオールー 2, 4、2-エチルヘキサンジオール-1, 3、ジエチ ングリコール、トリプロピレングリコール、グリセリン などの多価アルコール系溶媒:

【0031】アセトン、メチルエチルケトン、メチルー n-プロピルケトン、メチル-n-ブチルケトン、ジェ チルケトン、メチルーiーブチルケトン、メチルーnー ペンチルケトン、エチルーn-ブチルケトン、メチルー n-ヘキシルケトン、ジーi-ブチルケトン、トリメチ ルノナノン、シクロヘキサノン、2-ヘキサノン、メチ ルシクロヘキサノン、2、4-ペンタンジオン、アセト ニルアセトン、ジアセトンアルコール、アセトフェノ ン、フェンチョンなどのケトン系溶媒:

【0032】エチルエーテル、i-プロビルエーテル、 n-ブチルエーテル、n-ヘキシルエーテル、2-エチ ルヘキシルエーテル、エチレンオキシド、1,2-プロ ピレンオキシド、ジオキソラン、4-メチルジオキソラ ン、ジオキサン、ジメチルジオキサン、エチレングリコ ールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノエチ ルエーテル、エチレングリコールジエチルエーテル、エ チレングリコールモノ-n-ブチルエーテル、エチレン 10 グリコールモノー n ーヘキシルエーテル、エチレングリ コールモノフェニルエーテル、エチレングリコールモノ -2-エチルブチルエーテル、エチレングリコールジブ チルエーテル、ジエチレングリコールモノメチルエーテ ル、ジエチレングリコールモノエチルエーテル、ジエチ レングリコールジエチルエーテル、ジエチレングリコー ルモノー n - ブチルエーテル、ジエチレングリコールジ -n-ブチルエーテル、ジエチレングリコールモノ-n -ヘキシルエーテル、エトキシトリグリコール、テトラ エチレングリコールジー n ープチルエーテル、プロビレ ノール、i -ペンタノール、2 - メチルブタノール、s 20 ングリコールモノメチルエーテル、プロピレングリコー ルモノエチルエーテル、プロピレングリコールモノプロ ピルエーテル、プロピレングリコールモノブチルエーテ ル、ジプロピレングリコールモノメチルエーテル、ジブ ロピレングリコールモノエチルエーテル、トリプロピレ ングリコールモノメチルエーテル、テトラヒドロフラ ン、2-メチルテトラヒドロフランなどのエーテル系溶 媒;

【0033】ジエチルカーボネート、酢酸メチル、酢酸 エチル、アープチロラクトン、アーバレロラクトン、酢 酸nープロビル、酢酸iープロビル、酢酸nーブチル、 酢酸iーブチル、酢酸secーブチル、酢酸nーペンチ ル、酢酸sec‐ペンチル、酢酸3-メトキシブチル、 酢酸メチルペンチル、酢酸2-エチルブチル、酢酸2-エチルヘキシル、酢酸ベンジル、酢酸シクロヘキシル、 酢酸メチルシクロヘキシル、酢酸n-ノニル、アセト酢 酸メチル、アセト酢酸エチル、酢酸エチレングリコール モノメチルエーテル、酢酸エチレングリコールモノエチ ルエーテル、酢酸ジエチレングリコールモノメチルエー テル、酢酸ジエチレングリコールモノエチルエーテル、 レングリコール、ジプロピレングリコール、トリエチレ 40 酢酸ジエチレングリコールモノー n - ブチルエーテル、 酢酸プロピレングリコールモノメチルエーテル、酢酸プ ロビレングリコールモノエチルエーテル、酢酸プロビレ ングリコールモノプロビルエーテル、酢酸プロビレング リコールモノブチルエーテル、酢酸ジプロピレングリコ 一ルモノメチルエーテル、酢酸ジプロピレングリコール モノエチルエーテル、ジ酢酸グリコール、酢酸メトキシ トリグリコール、プロピオン酸エチル、プロピオン酸n - ブチル、プロピオン酸 i - アミル、シュウ酸ジエチ ル、シュウ酸ジーnーブチル、乳酸メチル、乳酸エチ 50 ル、乳酸n-ブチル、乳酸n-アミル、マロン酸ジエチ

13 ル、フタル酸ジメチル、フタル酸ジエチルなどのエステ ル系溶媒;

【0034】N-メチルホルムアミド、N, N-ジメチ ルホルムアミド、N, N-ジエチルホルムアミド、アセ トアミド、N-メチルアセトアミド、N, N-ジメチル アセトアミド、N-メチルプロピオンアミド、N-メチ ルピロリドンなどの含窒素系溶媒;硫化ジメチル、硫化 ジエチル、チオフェン、テトラヒドロチオフェン、ジメ チルスルホキシド、スルホラン、1,3-プロパンスル トンなどの含硫黄系溶媒などを挙げることができる。こ れらの有機溶剤は、1種あるいは2種以上を混合して使 用することができる。

【0035】本発明の組成物における(A)~(B)成 分、水および有機溶剤を使用する際の具体例としては、 (A)成分および(B)成分を溶解させた有機溶剤中に 水を断続的あるいは連続的に添加する。この際、触媒 は、有機溶剤中に予め添加しておいてもよいし、水添加 時に水中に溶解あるいは分散させておいてもよい。この 際の反応温度としては、通常、0~100℃、好ましく

は15~80℃であり、反応時間としては15分~24 20 時間、好ましくは30分~12時間である。

【0036】また、膜形成用組成物を構成するにあた り、組成物中の沸点100℃以下のアルコールの含量 が、20重量%以下、特に5重量%以下であることが好 ましい。沸点100℃以下のアルコールは、上記(A) 成分および (B) 成分で表される化合物の加水分解およ び/またはその縮合の際に生じる場合があり、その含量 が20重量%以下、好ましくは5重量%以下になるよう に蒸留などにより除去することが好ましい。

【0037】本発明の膜形成用組成物中における(A) 成分と(B)成分の使用割合は、(A)成分(完全加水 分解縮合物換算) 100重量部に対して、(B) 成分 (完全加水分解縮合物換算)が40~200重量部、よ り好ましくは45~180重量部である。(B)成分の 含有量が40重量部未満であると、非常に低い誘電率が 達成し難く、一方、200重量部を超えると、塗膜の機 械的強度が低下する。

【0038】本発明の膜形成用組成物には、さらに下記 のような成分を添加してもよい。

【0039】*β -ジケ<u>トン</u>*

β-ジケトンとしては、アセチルアセトン、2, 4-へ キサンジオン、2,4-ヘプタンジオン、3,5-ヘプ タンジオン、2,4-オクタンジオン、3,5-オクタ ンジオン、2,4-ノナンジオン、3,5-ノナンジオ ン、5-メチル-2,4-ヘキサンジオン、2,2, 6. 6-テトラメチル-3, 5-ヘプタンジオン、1, 1, 1, 5, 5, 5 - ヘキサフルオロー2, 4 - ヘプタ ンジオンなどの1種または2種以上である。本発明にお いて、膜形成用組成物中のβ-ジケトン含有量は、全溶 剤の $1\sim50$ 重量%、好ましくは $3\sim30$ 重量%とする 50 $(A)\sim(B)$ 成分および必要量の有機溶剤からなる

ことが好ましい。このような範囲でβージケトンを添加 すれば、一定の保存安定性が得られるとともに、膜形成 用組成物の塗膜均一性などの特性が低下する恐れが少な 4.5

【0040】その他の添加剤

本発明で得られる膜形成用組成物には、さらにコロイド 状シリカ、コロイド状アルミナ、有機ポリマー、界面活 性剤などの成分を添加してもよい。コロイド状シリカと は、例えば、高純度の無水ケイ酸を上記親水性有機溶媒 10 に分散した分散液であり、通常、平均粒径が5~30m μ、好ましくは10~20mμ、固形分濃度が10~4 0重量%程度のものである。このようなコロイド状シリ カとしては、例えば、日産化学工業(株)製、メタノー ルシリカゾルおよびイソプロパノールシリカゾル;触媒 化成工業(株)製、オスカルなどが挙げられる。 コロイ ド状アルミナとしては、日産化学工業(株)製のアルミ ナゾル520、同100、同200;川研ファインケミ カル (株) 製のアルミナクリアーゾル、アルミナゾル1 0、同132などが挙げられる。

【0041】有機ポリマーとしては、例えば、ポリアル キレンオキサイド構造を有する化合物、糖鎖構造を有す る化合物、ビニルアミド系重合体、(メタ) アクリレー ト化合物、芳香族ビニル化合物、デンドリマー、ポリイ ミド、ポリアミック酸、ポリアリーレン、ポリアミド、 ポリキノキサリン、ポリオキサジアゾール、フッ素系重 合体などを挙げることができる。界面活性剤としては、 例えば、ノニオン系界面活性剤、アニオン系界面活性 剤、カチオン系界面活性剤、両性界面活性剤などが挙げ られ、さらには、シリコーン系界面活性剤、ポリアルキ 30 レンオキシド系界面活性剤、含フッ素界面活性剤などを 挙げることができる。

【0042】なお、本発明で得られる膜形成用組成物に おいて、この組成物中のナトリウム含量を20ppb以 内の値とするのが好ましい。このような範囲にナトリウ ム含量を限定することにより、半導体などの層間絶縁膜 材料に用いた場合でも、電気回路などの信頼性を低下さ せる恐れがない。また、腐食の発生をより効率的に防止 しながら、均一な厚さの層間絶縁膜とすることができ る。

【0043】膜形成用組成物の調製方法

本発明の膜形成用組成物を調製するに際しては、上記の ように、有機溶剤中、(A)~(B)成分を混合して、 触媒および水の存在下で、(A)~(B)成分を加水分 解し、縮合すればよく、特に限定されない。しかしなが ら、上記金属キレート化合物とβ-ジケトン類を使用す る場合には、組成物を調製後、最後にβージケトンを添 加する方法が採用される。

【0044】本発明の組成物の調製法の具体例として は、下記①~⑤の方法などを挙げることができる。

16

混合物に、所定量の水および触媒を加えて加水分解・縮 合反応を行なう方法。

②(A)~(B)成分および必要量の有機溶剤からなる 混合物に、所定量の水および触媒を加えて加水分解・縮 合反応を行ったのち、反応により生じたアルコール成分 を減圧除去する方法。

【0045】3(A)~(B)成分および必要量の有機 溶剤からなる混合物に、所定量の水および触媒を加えて 加水分解・縮合反応を行ったのち、βージケトンを添加 する方法。

④(A)~(B)成分および必要量の有機溶剤からなる 混合物に、所定量の水および触媒を加えて加水分解・縮 合反応を行ったのち、反応により生じたアルコール成分 を減圧除去したのち、βージケトンを添加する方法。

【0046】 (A) ~ (B) 成分および必要量の有機 溶剤からなる混合物に、所定量の水および触媒を加えて 加水分解・縮合反応を行ったのち、β-ジケトンを添加 したのち、反応により生じたアルコール成分を減圧除去 する方法。

【0047】このようにして得られる本発明の組成物の 20 50~400℃に加熱してもよい。 全固形分濃度は、好ましくは、2~30重量%であり、 使用目的に応じて適宜調整される。組成物の全固形分濃 度が2~30重量%であると、塗膜の膜厚が適当な範囲 となり、保存安定性もより優れるものである。ととで、 固形分濃度は、上記有機溶剤の使用量によって、容易に 調整することができる。また、このようにして得られる 組成物中の(A)~(B)成分の加水分解縮合物の重量 平均分子量は、通常、1,000~120,000、好 ましくは1,200~100,000程度である。

【0048】このようにして得られる本発明の組成物 を、シリコンウエハ、SiO₂ ウエハ、SiNウエハな どの基材に塗布する際には、スピンコート法、浸漬法、 ロールコート法、スプレー法などの塗装手段が用いられ る。

【0049】この際の膜厚は、乾燥膜厚として、1回塗 りで厚さ0.05~1.5 μm程度、2回塗りでは厚さ $0.1 \sim 3 \mu m$ 程度の塗膜を形成することができる。そ の後、常温で乾燥するか、あるいは、80~600℃程 度の温度で、通常、5~240分程度加熱して乾燥する 熱方法としては、ホットプレート、オーブン、ファーネ スなどを使用することができ、加熱雰囲気としては、大 気下、窒素雰囲気、アルゴン雰囲気、真空下、酸素濃度 をコントロールした減圧下などで行うことができる。

【0050】また、塗膜を基材に塗布したのち、あるい は塗布した基材を加熱後に電子線や紫外線を照射するこ とで、塗膜の機械的強度をさらに向上させることも可能 である。

【0051】さらには、加熱終了後の塗膜形成基材に対

ことも可能である。シリル化処理剤としては、例えば、 アリロキシトリメチルシラン、N, O-ビス (トリメチ ルシリル)アセトアミド、ビス(トリメチルシリル)ト リフルオロアセトアミド、ビス (トリメチルシリル) 尿 素、トリメチルクロロシラン、N-(トリメチルシリ ル) アセトアミド、トリメチルシリルアジド、トリメチ ルシリルシアナニド、N- (トリメチルシリル) イミダ ゾール、3-トリメチルシリル-2-オキサゾリジノ ン、トリメチルシリルトリフルオロメタンスルフォネー 10 ト、ヘキサメチルジシラザン、ヘプタメチルジシラザ ン、ヘキサメチルジシロキサン、N-メチル-N-トリ メチルシリルトリフルオロアセトアミド、(N, N-ジ メチルアミノ)トリメチルシラン、ノナメチルトリシラ ザン、1, 1, 3, 3-テトラメチルジシラザン、トリ メチルヨードシランなどを挙げることができる。塗膜の シリル化は、上記シリル化剤を直接または溶剤希釈した のち、塗膜上にディップコートやスピンコートすること や、シリル化剤の蒸気雰囲気に塗膜を曝すことによって 行うことができる。さらには、シリル化処理後、塗膜を

【0052】このようにして得られる膜(層間絶縁膜用 材料)は、絶縁性に優れ、塗布膜の均一性、誘電率特 性、塗膜の耐クラック性、塗膜の表面硬度に優れるか **ら、LSI、システムLSI、DRAM、SDRAM、** RDRAM、D-RDRAMなどの半導体素子用層間絶 縁膜、半導体素子の表面コート膜などの保護膜、多層配 線基板の層間絶縁膜、液晶表示素子用の保護膜や絶縁防 止膜などの用途に有用である。

[0053]

30 【実施例】以下、この発明の実施の形態を、実施例に基 づいて説明する。ただし、以下の記載は、本発明の態様 例を概括的に示すものであり、この記載により本発明が 限定されるものではない。なお、膜形成用組成物の評価 は、次のようにして行なった。

【0054】膜厚均一性

形成用組成物を、8インチシリコンウエハ上に、スピン コーターを用いて、回転数1,800грm、20秒の 条件で以て塗布した。その後、ホットプレート上で80 ℃で5分間、200℃で5分間基板を乾燥し、さらに4 ことにより、塗膜を形成することができる。この際の加 40 60℃、0.1 Torrの減圧オーブン中で60分、基 板を焼成した。このようにして得られた塗膜の膜厚を、 光学式膜厚計(Rudolph Technologi es社製、Spectra Laser200)を用い て塗膜面内で50点測定した。得られた膜厚の3σを計 算し、下記基準で評価した。

○:塗膜の3σが100nm未満

×: 塗膜の3σが100n m以上

【0055】耐クラック性

8 インチシリコンウエハ上に、スピンコート法を用いて して、塗膜をシリル化処理し、塗膜の吸水性を改良する 50 組成物試料を塗布し、ホットプレート上で80℃で5分

間、200℃で5分間基板を乾燥し、さらに460℃、 0.1Torrの減圧オーブン中で60分基板を焼成し た。得られた塗膜の外観を35万ルクスの表面観察用ラ ンブで観察し、下記基準で評価した。クラックの発生の 無い最大膜厚をクラック限界膜厚と定義した。

〇:塗膜表面にクラックが認められない、

×:塗膜表面にクラックが認められる。

【0056】誘電率

8インチシリコンウエハ上に、スピンコート法を用いて 組成物試料を塗布し、ホットプレート上で80℃で5分 10 間、200℃で5分間基板を乾燥し、さらに460℃、 0.1Torrの減圧オーブン中で60分基板を焼成し た。得られた基板上にアルミニウムを蒸着し、誘電率評 価用基板を作製した。誘電率は、横川・ヒューレットバ ッカード (株) 製、HP16451B電極およびHP4 284AプレシジョンLCRメーター用いて、100k Hzにおける容量値から算出した。

【0057】弾性率

8 インチシリコンウエハ上に、スピンコート法を用いて 組成物試料を塗布し、ホットプレート上で80℃で5分 20 間、200℃で5分間基板を乾燥し、さらに460℃、 0.1 Torrの減圧オーブン中で60分基板を焼成し た。得られた膜をナノインデンターXP(ナノインスツ ルメンツ社製)を用いて連続剛性測定法により測定し

【0058】合成例1

石英製セパラブルフラスコ中で、メチルトリメトキシシ ラン203.6gとiso-ブチルトリメトキシシラン 109.28をプロピレングリコールモノメチルエーテ ル353gに溶解させたのち、スリーワンモーターで攪 30 拌させ、溶液温度を50℃に安定させた。次に、マロン 酸8.8gを溶解させたイオン交換水125gを1時間 かけて溶液に添加した。その後、50℃で2時間反応さ せたのち、反応液を室温まで冷却した。この反応液に、 プロピレングリコールモノメチルエーテルを405g添 加し、50℃で反応液からメタノールおよび水を含む溶 液を405gエバボレーションで除去し、反応液(A-1)を得た。

【0059】合成例2

石英製セパラブルフラスコ中で、メチルトリメトキシシ ラン203.6gとシクロヘキシルトリメトキシシラン 101.1gをプロビレングリコールモノプロビルエー テル368gに溶解させたのち、スリーワンモーターで 攪拌させ、溶液温度を50℃に安定させた。次に、マロ ン酸8.8gを溶解させたイオン交換水118gを1時 間かけて溶液に添加した。その後、50℃で2時間反応 させたのち、反応液を室温まで冷却した。この反応液 に、プロビレングリコールモノプロビルエーテルを38 2g添加し、50℃で反応液からメタノールおよび水を 含む溶液を382gエバボレーションで除去し、反応液 50 グリコールモノメチルエーテル596g添加し、50℃

(A-2)を得た。

【0060】合成例3

石英製セパラブルフラスコ中で、メチルトリメトキシシ ラン135.7gとシクロヘキシルトリメトキシシラン 151.6gをプロピレングリコールモノメチルエーテ ルアセテート401gに溶解させたのち、スリーワンモ ーターで攪拌させ、溶液温度を50℃に安定させた。次 に、マロン酸8.8gを溶解させたイオン交換水103 gを1時間かけて溶液に添加した。その後、50℃で2 時間反応させたのち、反応液を室温まで冷却した。この 反応液にプロピレングリコールモノメチルエーテルアセ テート334g添加し、50℃で反応液からメタノール および水を含む溶液を334gエバボレーションで除去 し、反応液(A-3)を得た。

【0061】合成例4

石英製セバラブルフラスコ中で、メチルトリメトキシシ ラン135.7gとシクロヘキシルトリメトキシシラン 151.6gとジイソプロポキシチタンビスエチルアセ チルアセテート1. 1gをプロピレングリコールモノメ チルエーテルアセテート401gに溶解させたのち、ス リーワンモーターで攪拌させ、溶液温度を50℃に安定 させた。次に、イオン交換水103gを1時間かけて溶 液に添加した。その後、50℃で2時間反応させたの ち、反応液を室温まで冷却した。この反応液にプロビレ ングリコールモノメチルエーテルアセテート334g添 加し、50℃で反応液からメタノールおよび水を含む溶 液を334gエバポレーションで除去し、反応液(A-4)を得た。

【0062】合成例5

石英製セパラブルフラスコ中で、メチルトリメトキシシ ラン339.3gのみをプロピレングリコールモノメチ ルエーテル304gに溶解させたのち、スリーワンモー ターで攪拌させ、溶液温度を50℃に安定させた。次 に、マレイン酸8.8gを溶解させたイオン交換水14 8gを1時間かけて溶液に添加した。その後、50℃で 2時間反応させたのち、反応液を室温まで冷却した。 と の反応液にプロピレングリコールモノメチルエーテルを 479g添加し、50℃で反応液からメタノールおよび 水を含む溶液を479gエバポレーションで除去し、反 応液 (B-1)を得た。

【0063】合成例6

石英製セパラブルフラスコ中で、メチルトリメトキシシ ラン169.7gとテトラメトキシシラン211.8g をプロピレングリコールモノメチルエーテル225gに 溶解させたのち、スリーワンモーターで攪拌させ、溶液 温度を50℃に安定させた。次に、マレイン酸8.8g を溶解させたイオン交換水184gを1時間かけて溶液 に添加した。その後、50℃で2時間反応させたのち、 反応液を室温まで冷却した。この反応液に、プロピレン

で反応液からメタノールおよび水を含む溶液を596g エバポレーションで除去し、反応液(B-2)を得た。 【0064】実施例1

合成例1で得られた反応液(A-1)を、0.2μm孔 径のポリテトラフルオロエチレン製フィルターでろ過を 行い、スピンコート法でシリコンウエハ上に塗布した。 得られた塗膜の塗膜の膜厚は、580 n m であり、3σ は60nmと良好であった。塗膜の膜厚を変えてクラッ クの発生しない最大膜厚を評価したところ、1,400 率を測定したところ、2. 43と非常に低い値であっ た。さらに、塗膜の弾性率を評価したところ、3.9G Paと髙い値を示した。

【0065】実施例2

実施例1において、塗膜を460℃、0.1Torrの 滅圧オーブン中で60分基板を焼成したのち、ヘキサメ チルジシラザンを5重量%含有するエチレングリコール ジメチルエーテル溶液に基板を10分間浸漬したのち、 300℃の真空オーブンで1時間加熱した。得られた塗 膜の塗膜の膜厚は、570nmであり、3 σ は80nm 20 3.11、得られた塗膜のクラック限界膜厚は990n と良好であった。塗膜の膜厚を変えてクラックの発生し ない最大膜厚を評価したところ、1,450nmと優れ たクラック耐性を示した。また、塗膜の誘電率を測定し*

*たところ、2.20と非常に低い値であった。さらに、 塗膜の弾性率を評価したところ、3.8GPaと高い値 を示した。

【0066】実施例3~5

合成例2~4で得られた反応液(A-2)、(A-3) および(A-4)をそれぞれ使用した以外は、実施例1 と同様に塗膜を評価した。評価結果を表1に示す。

【0067】比較例1

合成例5で得られた反応液(B-1)を使用した以外 nmと優れたクラック耐性を示した。また、塗膜の誘電 10 は、実施例1と同様に実施例1と同様に塗膜の評価を行 った。塗膜の膜厚は、500nmで3σは77nm、誘 電率は2.64と比較的小さな値であったが、得られた 塗膜のクラック限界膜厚は820nmと劣り、弾性率も 2. 5GPaと低い値であった。

【0068】比較例2

合成例6で得られた反応液(B-2)を使用した以外 は、実施例1と同様に実施例1と同様に塗膜の評価を行 った。塗膜の弾性率3.5GPaと高い値であったが、 塗膜の膜厚は570nmで3σは160nm、誘電率は mと劣るものであった。

[0069]

【表1】

-				
実 反応液	塗膜膜厚	膜厚均一性	耐クラック性	誘電率 弾性率
施		(3σ)	(クラック限界	(GPa)
例	(nm)	(nm)	膜厚, nm)	
1-1				
			(1,400)	
-				
			(1,450)	
-				
			O (1,520)	
-				
			(1,550)	
-				
			(1, 380)	
-	1			

[0070]

キシシランを組み合わせて、加水分解・縮合させた加水 分解縮合物を含有させることにより、塗布膜における厚※

※さの均一性、クラック耐性、非常に小さい誘電率、弾性 【発明の効果】本発明によれば、特定の2種類のアルコ 40 率特性などのバランスに優れた膜形成用組成物(層間絶 縁膜用材料)を提供することが可能である。

フロントページの続き

(72)発明者 篠田 智隆

東京都中央区築地二丁目11番24号 ジェイ エスアール株式会社内

(72)発明者 山田 欣司

東京都中央区築地二丁目11番24号 ジェイ エスアール株式会社内